# WL82 高低温测试

### 1.1 测试目的

在温度范围-40℃到80℃,探测CPU在内核电压最低挡位1.26V和最高挡位1.38V时的稳定运行速度。

## 1.2 测试仪器及工具

高低温箱、笔记本电脑、WL82 开发板(顶板及底板)、USB 转 TTL 串口(或杰理升级工具)、万用表

### 1.3 测试条件及结果

#### ①关闭 SDRAM

测试程序: DMA\_COPY+CPU\_BenchMark

测试 序号	1	2	3	4	5	6	7	8
测试板 数量	1	1	2	2	2	2	4	4
温度	-40	-40	-40	80	80	-40	80	-40
设置内核 电压(V)	1.38	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.38	1.38
实测内核 电压(V)	1.357	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.351	1.351
sys_clk (MHz)	384	384	396	396	408	408	408	408
sdram_clk (MHz)	0	0	0	0	0	0	0	0
hsb_clk (MHz)	192	192	198	198	204	204	204	204

lsb_clk	64	64	66	66	68	68	68	68
(MHz)	04	04	00	00	08	08	08	00
sfc_clk	96	96	99	99	102	102	102	102
(MHz)	90	90	99	99	102	102	102	102
测试时间	17	13	12	4	4	4	4	4
(h)	1 /	13	12	4	4	4	4	4
							正常	正常
运行	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
情况	上 币		11.节	1上市	异常	正常	正常	正常
							异常	正常

## ②打开 SDRAM

测试程序: DMA\_COPY

测试	1	2	3	4	5	6	7
序号							
测试板	4	4	4	4	4	4	4
数量							
温度	80	-40	80	-40	80	-40	80
(℃)		-40	80	-40	80	-40	80
设置内核	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
电压 (V)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
实测内核	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188
电压 (V)		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
sys_clk	396	396	320	320	320	320	320
(MHz)	390	390	320	320	320	320	320
sdram_clk	198	198	240	240	252	252	258
(MHz)							
hsb_clk	198	198	160	160	160	160	160
(MHz)		190	100	100	100	100	100

lsb_clk	66	66	53.33	53.33	53.33	53.33	53.33
(MHz)	00	00	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33
sfc_clk	99	99	80	80	80	80	80
(MHz)		99	80	80	80	80	80
测试时间	12	4	12	4	8	12	4
(h)	12	4	12	4	8	12	4
	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
运行	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
情况	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
	正常	正常	正常	正常	正常	正常	异常

### 1.4 测试结论

通过对 WL82 进行高低温测试得到如下测试结论:

- ①WL82 推荐的系统频率和 SDRAM 频率配置为: 320MHz+240MHz;
- ②若有更高要求的客户,系统频率和 SDRAM 频率配置可设为: 396MHz+198MHz;
- ③若客户系统频率配置超过了396MHz,存在一定的风险;
- ④在第一次低温测试后内核电压变为 1. 321V,相较低温测试前的 1. 357V,内核电压有所减小。